

RCJ 発行資料一覧と入手方法

当センターでは、定期刊行物の「RCJ 会報」の他に、電子部品の信頼性に関する規格、電子部品・電子機器の信頼性に関する調査試験研究の成果報告書を発行しておりますのでご利用下さい。

1. コードによる分類

当センター発行の規格、調査試験研究成果報告書は、次のコードにより分類しています。

(1) 電子部品の信頼性に関する規格 (RCJS)

RCJS - ○○○○ - ○○○○
① ② ③

- ① RCJ 規格であることを示す記号。
- ② 規格制定順の追番号を表す。
- ③ 規格制定年を西暦で示す。

(2) 電子部品・電子機器の信頼性に関する調査試験研究の成果等の刊行物

R - ○○ - ○○ - ○○
① ② ③ ④

- ① 当センターの刊行物であることを示す。
- ② 発行した年を二桁で示す。
- ③ D：電子デバイス、E：環境試験、R：信頼性、M：測定方法、P：受動部品（C、Rなど）
Q：認証関係、S：半導体デバイス
なお、必要な場合は上記の分類コードの二つを組み合わせで表す。
(例) ES：半導体デバイスの環境試験
RS：半導体デバイスの信頼性
- ④ ③による分類の中で年度ごとによる発行順の追番号を二桁の数で示す。

2. 入手方法と頒布価格

当センター発行資料は、一般の書店では取り扱っておりません。

ご購入の向きは、直接下記へご注文下さい。

なお、郵送の場合の送料（実費）を別途申し受けます。

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-6 カミナガビル 3階
一般財団法人 日本電子部品信頼性センター 総務部
(TEL: 03-5830-7601 FAX: 03-5830-7602)

3. 代金の支払い方法

ご注文あり次第、現品に請求書を添えて送付いたしますので、受領されましたら請求書に指定した銀行口座に代金をお振り込み下さい。

1. 定期刊行物

名 称	頒 布 価 格	備 考
R C J 会 報	年 4 回 発 行 一 部 に つ き 4 0 0 円	年 間 予 約 購 読 を お 勧 め し ま す 。

2. 電子部品の信頼性に関する規格及びガイドライン

分類コード 番 号	名 称	頒布価格 (円) (消費税含まず)	
		会 員	一 般
SQA-6-01	半導体デバイス規格研究委員会成果報告書 CECC 0080X I .CECC 認証取得企業のための TQM ガイドライン (一次仮訳) II .IEC/SC47A/373/CDV 製造業者認証と品質マネー ジメントのための手順 (仮訳速報)	2,000	3,000
SQA-7-01	技術認証スケジュール調査資料	2,000	3,000
SQA-9-01	IECQ 制度下におけるプロセス (工程) 認証	4,000	8,000
SQA-10-01	エレクトロニックプロセス認証規格 (仮訳)	4,000	8,000
SQA-11-01	部品マネジメント計画書のためのガイド(仮訳) I E C Q 001007-1-1 (Revision E)	2,000	3,000
SQA-12-01	デバイス規格研究委員会調査報告書 IEC QC 001007-1-2 (Revision G) 第 1 - 2 部 航空宇宙産業 : 製造業者指定温度範囲外で半導体デバイスを使用する ためのガイド (仮訳) IEC QC 001007-1-3 (Revision G) 第 1 - 3 部 航空宇宙産業 : 電子機器の信頼性審査のためのガイド (仮訳)	4,000	8,000
SQA-13-01	デバイス規格研究委員会調査報告書 電子機器の新しい信頼度予測方法 - P R I S M - <u>(CD 版のみ)</u>	5,000	7,000

3. 電子部品・電子機器の信頼性に関する調査試験研究成果の刊行物

分類コード 番号	名 称	頒布価格 (円) (消費税含まず)	
		会 員	一 般
R-8-ES-01	静電気放電(ESD)対策に関する調査研究成果報告書	3,000	4,000
R-8-EC-01	電子部品の故障率の基準条件及び換算のためのストレスモデル	3,000	5,000
R-8-EC-02	信頼性ストレススクリーニング	3,000	5,000
R-9-ES-01	ESD (静電気放電) に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究報告書	7,000	9,000
R-10-ES-01	ESD (静電気放電) に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究 (上) - 半導体デバイスの静電気破壊とその周辺 -	3,000	6,000
R-10-ES-02	ESD (静電気放電) に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究 (下) - 静電気対策用資材・機器とその周辺 -	5,000	8,000
R-11-ES-01	平成11年度 静電気研究委員会研究成果報告書	5,000	8,000
R-12-ES-01	平成12年度 静電気研究委員会研究成果報告書	5,000	8,000
R-13-ES-01	平成13年度 静電気研究委員会研究成果報告書 - 電子デバイスのESD 障害防止対策及び静電気測定器活用ガイド -	5,000	8,000
R-1-RS-01	VLSI 1MビットDRAMの信頼性試験に関する調査研究成果報告書	3,000	4,000
R-2-RS-01	VLSI 1MビットDRAMの信頼性試験 (その2) に関する調査研究成果報告書	3,000	4,000
R-2-RS-02	L S I の故障モデル式と加速寿命試験に関する調査研究成果報告書 (C D版のみ)	5,000	8,000
R-3-RS-01	VLSI 4MビットマスクROMの信頼性試験に関する調査研究成果報告書	4,000	5,000
R-4-RS-01	応力と半導体集積回路の信頼性に関する調査研究成果報告書	5,000	8,000
R-4-RS-02	VLSI 4MビットマスクROMの信頼性試験に関する調査研究成果報告書 (その2)	4,000	5,000

分類コード 番号	名 称	頒布価格 (円) (消費税含まず)	
		会 員	一 般
R-6-RS-01	VLSI 1M ビットフラッシュメモリの信頼性試験に関する調査研究成果報告書 (Ⅱ)	4,000	6,000
R-6-RS-02	半導体集積回路におけるインプロセス信頼性技術に関する調査研究成果報告書	8,000	10,000
R-7-RS-01	半導体故障物理研究委員会中間報告書	3,000	4,000
R-8-RS-01	半導体故障物理研究委員会成果報告書	5,000	8,000
R-9-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 - 最新フラッシュメモリ技術の信頼性 -	5,000	8,000
R-10-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 - 最新フラッシュメモリ技術及び LSI 加工応用 マイクロマシン技術の信頼性 -	5,000	8,000
R-11-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 - 薄層ゲート酸化膜の信頼性を中心として -	5,000	8,000
R-12-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書	5,000	8,000
R-13-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - 最新 VLSI 要素技術 (酸化膜と多層配線) の故障物理と信頼 性から見た Si 半導体技術の限界 -	5,000	8,000
R-14-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - 最新 VLSI 要素技術 (酸化膜と多層配線) の信頼性と微細化 限界 -	5,000	8,000
R-15-RS-01	故障物理研究委員会成果報告書 - 最新 ULSI 要素技術の故障物理とバーンイン技術 -	5,000	8,000
R-16-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - バーンイン技術と最新 ULSI 信頼性の話題 -	5,000	8,000
R-17-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - 最新 ULSI 故障物理及び最新不揮発性メモリ技術と信頼性	5,000	8,000
R-18-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - 次世代技術ロードマップと信頼性課題 -	5,000	8,000
R-19-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - 負バイアス温度不安定性現象 (NBTI) を中心として -	5,000	8,000
R-20-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - 負バイアス温度不安定性現象 (NBTI) と ランダム・テレグラフ・シグナル (RTS) ノイズ現象 -	5,000	8,000

R-21-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - LSI のばらつきと信頼性及び 最近の話題 (NBTI、信頼性保証) - (CD 版のみ)	5,000	8,000
R-23-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - 負バイアス温度不安定性現象 (NBTI) と 中性子線ソフトエラー - (CD 版のみ)	5,000	8,000
R-24-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - LSI のばらつきと信頼性及び最近の話題 (中性子線ソフトエラー、パワー半導体の信頼性) - (予定) (CD 版のみ)	5,000	8,000
R-25-RS-01	故障物理研究委員会研究成果報告書 - 新しい電子材料・電子デバイス、パワー半導体の動向と 信頼性、及び LSI の信頼性 - (CD 版のみ)	5,000	8,000
R-25-RC-01	平成 25 年度電子部品信頼性研究委員会成果報告 - 機能安全規格の解説と SIL (ASIL) 評価のための電子部品 故障率予測ガイドライン - (CD 版のみ)	8,000	12,000
R-26-RC-01	「平成 26 年度電子部品信頼性研究委員会成果報告 - ハードウェアの SIL (ASIL) 評価例及び FIDES (電子部品故障率モデル) の解説と算出例 - (CD 版のみ)	8,000	12,000

前記の〈規格及び刊行物〉以外に在庫がなくなりましたものは、当センターにおいて下されば閲覧することができますのでご利用下さい。

4. 信頼性シンポジウム予稿集

名 称	頒布価格 (消費税含まず)	
	会 員	一 般
RCJ 第1回 電子デバイスの信頼性シンポジウム予稿集(1991) (CD版のみ)	3,000	4,000
RCJ 第1回 EOS/ESD信頼性シンポジウム予稿集(1991) (CD版のみ)	3,000	4,000
RCJ 第2回 電子デバイスの信頼性シンポジウム予稿集(1992) (CD版のみ)	3,000	4,000
RCJ 第2回 EOS/ESD信頼性シンポジウム予稿集(1992) (CD版のみ)	3,000	4,000
RCJ 第3回 電子デバイスの信頼性シンポジウム予稿集(1993) (CD版のみ)	3,000	4,000
RCJ 第3回 EOS/ESD信頼性シンポジウム予稿集(1993) (CD版のみ)	3,000	4,000

R C J 第4回 電子デバイスの信頼性シンポジウム予稿集(1994) (CD版のみ)	3,000	4,000
R C J 第4回 E O S / E S D 信頼性シンポジウム予稿集(1994) (CD版のみ)	3,000	4,000
R C J 第5回 電子デバイスの信頼性シンポジウム予稿集(1995) (CD版のみ)	3,000	4,000
R C J 第5回 E O S / E S D 信頼性シンポジウム予稿集(1995) (CD版のみ)	3,000	4,000
R C J 第6回 電子デバイスの信頼性シンポジウム予稿集(1996) (CD版のみ)	4,000	5,000
R C J 第6回 E O S / E S D 信頼性シンポジウム予稿集(1996) (CD版のみ)	4,000	5,000
R C J 第7回 信頼性シンポジウム予稿集 (1997)	9,000	12,000
R C J 第7回 信頼性シンポジウム予稿集 (1997)	9, 000	10, 000
R C J 第8回 信頼性シンポジウム予稿集 (1998)	9, 000	12, 000
R C J 第9回 信頼性シンポジウム予稿集 (1999)	9, 000	12, 000
R C J 第10回 信頼性シンポジウム予稿集 (2000)	9, 000	12, 000
R C J 第11回 信頼性シンポジウム予稿集 (2001) (CD版のみ)	7, 000	10, 000
R C J 第12回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2002)	9, 000	12, 000
R C J 第13回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2003)	9, 000	12, 000
R C J 第14回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2004) (CD版のみ)	7, 000	10, 000
R C J 第15回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2005)	9, 000	12, 000
R C J 第16回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2006)	9, 000	12, 000
R C J 第17回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2007)	9, 000	12, 000
R C J 第18回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2008)	9, 000	12, 000
R C J 第19回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2009)	9, 000	12, 000
R C J 第20回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2010) (CD版有り)	9, 000	12, 000
R C J 第21回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2011) (CD版有り)	9, 000	12, 000
R C J 第22回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2012) (CD版有り)	9, 000	12, 000
R C J 第23回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2013) (CD版有り)	9, 000	12, 000
R C J 第24回 信頼性シンポジウム発表論文集 (2014) (CD版有り)	9, 000	12, 000

5. ESDコーディネータ関係資料・本

名 称	頒 布 価 格 (消費税含まず)	
	会 員	一 般
RCJS-5-1 (第2版) :2014 静電気現象からの電子デバイスの保護－ 一般的要求事項	3,500	8,000
RCJS-TR-5-2:2013 静電気現象からの電子デバイスの保護－指針	4,571	9,523
RCJ 出版本 「静電気管理のためのデータブック」(二澤 正行 監修、(一財)日本電子部品信頼性セ ンター編 2012年5月発行予定) －静電気管理用資材等の測定方法と実測データ－	7,300	7,300
その他出版社(推薦図書) 「静電気管理技術の基礎(増補改訂版)」(二澤 正行 著、プラスチック・エージ社) (2009年4月30日発行)	6,600 (会員、一般の区別 無し)	
「静電気管理入門」(二澤 正行 編著 森北出版:2011年10月発行)	3,600	
「MIL規格に基づく静電気管理」(RCJ監修 二澤 正行 編著 工業調査会:2008年 10月発行) －絶版になっていますが、残部が残っていますので、希望者には販売致します。)	2,400	

